物構研シンポジウム'09 放射光・中性子・ミュオンを用いた表面・界面科学の最前線 2009年11月17-18日(17日(金))@つくば国際会議場エポカル

# その場放射光電子分光による 強相関ヘテロ界面の電子状態の研究

東京大学大学院工学系研究科 JST-さきがけ 東大放射光連携研究機構

<complex-block>



# COLLABORATORS

東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻 SR 吉松公平、 **【**隆太郎、簑原誠人 近松彰 屈場弘 尾嶋正治#,+ \*東大院理 東京大学大学院理由 和達大樹、滝沢優、藤森 高エネルギー加速器研究 ∎携研究機構 久保田正人、 東京大学物性研究所 Mikk Lippmaa 東北大学金属材料研究可 川崎雅司# 東京大学大学院新領域研究 鯉沼秀臣

はじめに

. 成膜技術(レーザーMBE法など)の発展により、原 子レベルで構造を制御した酸化物薄膜・超格子の 作製が可能となった。

- 2. 強相関酸化物においても、今後、物質設計の自由 度が高く、物性を曾由自在に制御可能な「超構 造」を用いた研究が主流になる。
- 3. 放射光を用いた分光法は、酸化物薄膜・超格子研 究の強力な牽引力になる。

# INTRODUCTION



## SR analysis for oxide heterointerface



## **Advantage of SR-PES**



## In-situ PES + Laser MBE system



## **Combinatorial Laser MBE Apparatus**



#### Atomically-flat surface of La<sub>1-x</sub>Sr<sub>x</sub>MnO<sub>3</sub> thin films



**0.4**nm

# **Well-ordered Surface**

100 nm

#### **Combinatorial Laser MBE Apparatus** Laser Molecular Beam Epitaxy er ing Substrate [001] A'B'O<sub>3</sub> tor e used ABO<sub>3</sub> $O_2$ aser inlet Plume ABO<sub>3</sub> M Ceramic ABO<sub>3</sub> Target tor **RHEED** Oscillation A'B'O<sub>3</sub> intensity (arb. units) <sup>1ML</sup><sub>2ML</sub><sub>3ML</sub> Start LSMO (x=0.4) depositoin 50 100 150 200 250 300 0 ٥n Time (sec)



at the Interface (Mn 3*d* PDOS)





Spectral Evidence of Charge Transfer at LSMO/LSFO Interface

H. Kumigashira et al., Appl. Phys. Lett. 84, 5353 (2004).



#### Comparison of Fe-2*p* XAS spectra between Interfacial LSFO layer and LSFO films



![](_page_15_Figure_0.jpeg)

## **Origin of Charge Transfer**

![](_page_16_Figure_1.jpeg)

# Interfacial Electronic Structure of LaAlO<sub>3</sub>/ SrTiO<sub>3</sub> Heterojunctions

#### $LaAIO_3/TiO_2-SrTiO_3$

![](_page_17_Figure_2.jpeg)

#### n-type (Metallic)

#### LaAlO<sub>3</sub>/SrO-SrTiO<sub>3</sub>

![](_page_17_Figure_5.jpeg)

A. Ohtomo and H. Y. Hwang, Nature 427, 423 ('04).

### Origin of the Metallic Interface

![](_page_18_Figure_1.jpeg)

**DOS** at E<sub>F</sub> is different between the two scenarios.

#### **Detection Limit of PES Mearuements** 1. Charge Transfer 2. Oxygen Vacancies (wide distribution over STO) Confinement@interface region) LaAIO<sub>3</sub> LaAIO<sub>3</sub> n n λ SrTiO<sub>3-d</sub> SrTiO<sub>3-d</sub> $\mathbf{I}_{\mathsf{PES}} = \exp(-d/\lambda)$ **PES detection limit** d Ti 3*d* **O** 2*p* **O** 2*p* **Ti** 3*d* **Ti 3***d* $E_{F}$ $E_{F}$ $E_{F}$

DOS at E<sub>F</sub> is different between the two scenarios.

#### Valence Band Spectra of n-type Interfaces

![](_page_20_Figure_1.jpeg)

![](_page_20_Figure_2.jpeg)

T. Yoshida *et al.*, Europhys. Lett. **59**, 258 ('02)

#### No detectable Ti 3*d* DOS at E<sub>F</sub>

## Numerical Simulations

# Confinement at the interface $(\delta \text{ function})$

![](_page_21_Figure_2.jpeg)

The 3*d* electrons only exist at  $TiO_2$  layer adjacent to (LaO)+ layer.

![](_page_21_Figure_4.jpeg)

![](_page_22_Figure_0.jpeg)

#### Ti $2p \rightarrow 3d$ Resonant Spectra

Chemical stabilities of  $Ti^{4+}$  states in  $TiO_2$  irrespective of the neighboring donor LaO layer

![](_page_22_Figure_3.jpeg)

Charge transfer doesn't occur at the LAO/STO interface.

## Band Diagram of the n-type Interface

LaAlO<sub>3</sub> / TiO<sub>2</sub>-SrTiO<sub>3</sub>

Valence band spectra

LaAlO<sub>3</sub> / TiO<sub>2</sub>-SrTiO<sub>3</sub>

Eg(STO) = 3.2 eVEg(LAO) = 5.6 eV

![](_page_23_Figure_2.jpeg)

- 1. VBM of STO is located at 2.9-3.0 eV below  $E_{F}$ .
- 2. VBM is nearly continuous between STO and LAO.

(The leading edge of valence band structures is located at almost constant energy position.)

## Band Diagram of the n-type Interface

![](_page_24_Figure_1.jpeg)

### Band Diagram of LAO/STO Interface

![](_page_25_Figure_1.jpeg)

#### No peak shift at the p-type interface

Band bending on the STO side is responsible for the metallic states.

![](_page_25_Figure_4.jpeg)

![](_page_26_Figure_0.jpeg)

The metallic conductivity originate from the accumulation of carriers on the notched structure formed at the interface.

![](_page_27_Figure_0.jpeg)

The notched structure disappears by inserting SrO atomic layer between LAO and STO.

# Summary in LAO/STO Interface

We determined the band diagrams of LAO/STO heterojunctions by using *in situ* photoemission spectroscopy.

#### We have found

- 1. There is no detectable Ti 3d DOS at EF expected from charge transfer through the interface.
- 2. Owing to the band discontinuity of LAO/STO, a notched structure is formed at the metallic interface.
- 3. The structure, however, is absent at the insulating interface.

The metallic states at the interface between band insulators LAO/STO originate not from charge transfer through the interface on a short-range scale but from the accumulation of carrier on a long-range scale.

## Conclusion

- レーザーMBE法 D法)の発展により、原子レベルで構造を制御し酸化物薄膜・超格子の作製が可能となった。
- 2. 強相関酸化物においても、後、物質設計の自由 度が高く、物性を自由自在に制御可能を取構 造」を用いた研究が主流になる。
- 3. 放射光を用いた分光法は酸化物薄に超格子研究の強力な牽引力になる。